

oznaczenie sprawy (numer referencyjny):  
**CRZP/49/009/D/24, ZP/38/WETI/24**

**DOSTAWA STOLIKA NA PRÓBKĘ DO UKŁADU  
METALOGRAFICZNEGO PRZYGOTOWANIA PRÓBEK METODĄ  
ŚCIERANIA JONOWEGO  
DLA WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I  
INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ.**

Przedmiotem zamówienia jest **dostawa stolika na próbki do układu metalograficznego przygotowania próbek metodą ścierania jonowego (Broad Ion Beam)**

**Dostawa obejmuje: 1 sztukę.**

**Wymagane parametry:**

- 3-osiowy stolik na próbki – ruch X: +/- 5 mm: dostęp do kontroli, kiedy próbka jest w komorze
- Ruch Y : +/- 1 mm, pozycja cięcia, dostęp do kontroli próbki, kiedy próbka jest w komorze
- Ruch Z : 0 do 6 mm – możliwe 2 próbki dla wymiaru max. 50 x 50 x 5 mm
- 2 próbki dla wymiaru max. 50 x 50 x 10 mm
- 5 sztuk masek
- Gwarancja co najmniej 12 miesięcy.

**Stolik musi być kompatybilny z urządzeniem do ścieniania jonowego Leica TIC3X.**